



Servicio de Apoyo a la
Investigación



SEMINARIO:

Microscopía electrónica con sistema de tomografía

3View by GATAN : Serial Block Face Scanning Electron
Microscopy, an automated high throughput three
dimensional imaging technique at EM resolutions

Lugar: Aula edificio SACE

Día: 18 de septiembre 2013

Hora: 10h

